

Instrukcja wyszukiwania danych w bazie SAWIOS

Dostęp do bazy: <http://www.ios.krakow.pl/sawios>

lub ze strony www Instytutu przez kliknięcie w zakładkę **Informacja Naukowo-Techniczna**, a następnie w Baza danych SAWIOS

Baza danych SAWIOS to inaczej **przegląd zawartości wybranych czasopism technicznych polskich i zagranicznych oraz materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IZTW**. Dobór artykułów rejestrowanych w bazie odbywa się według kryteriów, które stanowią dziedziny działalności badawczej Instytutu.

Każdy rekord bazy SAWIOS zawiera

dane bibliograficzne publikacji (autor/autorzy, tytuł artykułu w języku oryginalnej publikacji, tłumaczenie tytułu na język polski, źródło – tytuł czasopisma/publikacji, rok, tom, numery stron) oraz

krótkie streszczenie jej zawartości (notatka).

Zakres tematyczny artykułów:

obróbka metali: wiórowa, ścierna, erozyjna, niekonwencjonalna, narzędzia skrawające; uchwyty i przyrządy obróbkowe; inżynieria materiałowa, zwłaszcza materiałów narzędziowych; metrologia techniczna; metody i techniki montażu, generatywne metody wytwarzania, komputerowe wspomaganie produkcji, systemy jakości

Obecnie baza SAWIOS liczy ponad 43 000 rekordów, najstarsze rejestrowane artykuły opublikowano w 1989 roku.

Zawartość przykładowego rekordu:

Biedunkiewicz A. i in.: Nanokompozyty wytwarzane metodą selektywnego stapiania/spiekania umocnione nanokrystalicznymi proszkami w układzie Fe-Ti-B-C.

Inż.Mater., 2012, t. 33, nr 6, s. 546-548.

W celu otrzymania nanokompozytów zastosowano metodę selektywnego laserowego spiekania i/lub stapiania (SLS/M). W procesie wytwarzania zastosowano komercyjny proszek stali nierdzewnej (osnowa) oraz nanokrystaliczne proszki TiC i Ti-B-C (faza umacniająca) otrzymane metodą zol-żel. Badano wpływ parametrów procesu SLM/S oraz udziału objętościowego nanokrystalicznych proszków na morfologię, mikrostrukturę oraz twardość uzyskanych nanokompozytów stal/nc-TiC i stal/nc-Ti-B-C. Stwierdzono dobrą dyspersję nanokrystalicznych cząstek w osnowie stalowej. W przypadku nanoproszków Ti-B-C zaobserwowano tendencję do tworzenia aglomeratów w matrycy stalowej, których średnica wynosiła do 3 µm. W procesach SLM/S wraz ze wzrostem objętościowego udziału faz umacniających osiągnięto znaczne zwiększenie twardości nanokompozytów w porównaniu z twardością osnowy.

Wyszukiwanie danych może odbywać się

- z pomocą INDEKSÓW
- bez użycia INDEKSÓW czyli bezpośrednio

Wyszukiwanie z pomocą indeksów

Dostępne są następujące indeksy

- indeks autorów
- indeks rejestrowanych w bazie SAWIOS czasopism i materiałów konferencyjnych
- indeks językowy (skrót od oryginalnych języków publikacji)
- indeks lat (rok publikacji)

Indeksy pełnią funkcję pomocniczą, tj. kliknięcie na wybranego autora, czasopismo lub język powoduje, że uzyskujemy wynik w postaci

- zbioru wszystkich rekordów danego autora lub autorów
- zbioru wszystkich rekordów zarejestrowanych w bazie pochodzących z danego czasopisma
- zbioru wszystkich rekordów z tytułem oryginalnym publikacji w wybranym języku
- zbioru wszystkich rekordów artykułów opublikowanych w wybranym roku

Wyszukiwanie bezpośrednio czyli według określonych kryteriów

Proszę rozwinąć listę dostępnych pól wyszukiwawczych (z lewej strony) i wybrać właściwe pole, jak niżej

Baza danych SAWIOS

Baza tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
© Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków | Instrukcja | Charakterystyka bazy | Wykaz źródeł indeksowanych w bazie | Historia zapytań
System Expertus dla baz CDS/ISIS, SPLENDOR Poznań

Wyświetl wskazówki

Skrót tytułu czasopisma [] INDEKS
Autorzy [] INDEKS
Słowa z tytułu oryginału []
Słowa z tytułu w języku polskim []
Słowa z notatki []
Skrót tytułu czasopisma [] SZUKAJ ANULUJ
Język []
Rok []
Dowolne słowa opisu []

Wskazówki można wpisać kilka wyrazów obok siebie.

Zawężanie wyników wyszukiwania

Rok: wszystkie lata (1988-) wybrany rok zakres lat

Język tekstu (brak wyboru == język dowolny):
 polski; angielski; rosyjski; niemiecki; francuski;
 włoski; czeski; słowacki; bułgarski; ukraiński; serbski;

Format: standardowy Szeregowanie wg numeru w bazie

Sposób wyszukiwania początek wyrazu patrz - instrukcja

Strona główna IZTW
IP użytkownika: 149.156.62.23
Ostatnia aktualizacja danych: 2013.04.12 08:29:22
Ostatni dostęp do bazy: 2013.04.16 13:49:14
Liczba użytkowników od 2010.11.09: 10292

Wybieramy spośród następujących pól:

- autorzy
- słowa z tytułu oryginału
- słowa z tytułu w j. polskim
- słowa z notatki
- skrót tytułu czasopisma
- język
- rok
- dowolne słowa opisu

Formularz wyszukiwania składa się z trzech wierszy – pól, które możemy dowolnie łączyć operatorami. Formularz akceptuje zarówno znaki diakrytyczne, jak też brak tych znaków np. *cięcie, wiązanie, twardość, Tönshoff* lub *ciecie, wiazanie, twardosc, Tonshoff*

Po wpisaniu pierwszych liter nazwiska autora (podpowiada INDEKS z prawej strony) lub skrótu tytułu czasopisma (podpowiada INDEKS z prawej strony) rozwija się żółte pole z podpowiedziami aktywnymi, tj. kliknięcie w określone nazwisko lub tytuł czasopisma powoduje umieszczenie tego kryterium w polu wyszukiwawczym.

Przykład:

Wybieramy najskuteczniejsze kryteria wyszukiwania (jeśli nie znamy nazwiska autora ani tytułu czasopisma) czyli „**dowolne słowa opisu**” lub „**słowa z notatki**” - nazywamy po polsku temat, na który poszukujemy informacji.

Proszę wpisywać terminy bez końcówki deklinacyjnej, bo wtedy nie zawężamy kryterium wyboru.

dowolne słowa opisu [można wpisać kilka obok siebie]

lub

słowa z notatki [można wpisać kilka obok siebie]

np.

toczen żeliw sferoidal zamiast „toczenie żeliwa sferoidalnego”

uchwyt tokarsk zamiast „uchwyt tokarski”

struktur gradientow

selektywn spiekan laser

rapid prototyp

ceramik azotk

powł nanostruktur

powł diamentopodobn

profilom

niepewność pomiar

Rezultat wyszukiwania będzie tym dokładniejszy, im precyzyjniej sformułujemy pytanie. Oznacza to, że należy wybrać możliwie dokładne kryteria.

Dodatkowo wyniki wyszukiwania możemy zawężyć:

- można wybrać lata publikacji, które nas interesują

- język oryginału (**jeden!**)

patrz: **Zawężanie wyników wyszukiwania**

Jeśli temat jest bardzo szczegółowy, nie należy zawężać kryteriów wyszukiwania.

Proszę wybrać operator logiczny (łączy pola wyszukiwawcze):

iloczyn (AND),

suma (OR),

różnica (to co w pierwszym okienku, z wyłączeniem tego co w drugim) – w takim przypadku możemy wypełnić tylko dwa pola - ta funkcja działa tylko w odniesieniu do kryteriów: autorzy i słowa z notatki

Nacisnąć klawisz: SZUKAJ i sprawdzić wyniki wyszukiwania

Wypełniony formularz wyszukiwania - przykłady

Baza danych SAWIOS, IZTW w Krakowie - Windows Internet Explorer

http://www.ios.krakow.pl/sawios/

Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc

Ulubione Translatca naukowo-technic... Zadziwiający Tłumacz (Słow... Web of Knowledge [v.5.7] ... LEKSYKA.PL - Słowniki inter... DPC4 - results-shortlist

Baza danych Sawios, IZTW w Krakowie

Baza danych SAWIOS

Baza tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
© Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków | Instrukcja | Charakterystyka bazy | Wykaz źródeł indeksowanych w bazie | Historia zapytań
System Expertus dla baz CDS/ISIS, SPLENDOR Poznań

Wyświetl wskazówki

Dowolne słowa opisu: rapid szybki prototyp

Język: pol INDEKS

Rok: INDEKS

Łączenie warunków: i / AND SZUKAJ ANULUJ

W polach słowa z tytułu oraz słowa z notatki można wpisać kilka wyrazów obok siebie.

Zawężanie wyników wyszukiwania

Rok: wszystkie lata (1988-) wybrany rok zakres lat

wpisz lata od-do: 2005 2010

Język tekstu (brak wyboru == język dowolny):
 polski; angielski; rosyjski; niemiecki; francuski;
 włoski; czeski; słowacki; bułgarski; ukraiński; serbski;

Format: standardowy Szeregowanie wg numeru w bazie

Sposób wyszukiwania: początek wyrazu patrz - instrukcja

Strona główna IZTW
IP użytkownika: 149.156.62.23
Ostatnia aktualizacja danych: 2013.04.12 08:29:22
Ostatni dostęp do bazy: 2013.04.16 13:49:14
Liczba użytkowników od 2010.11.09: 10292

Start ekp - Free... instrukcja... Baza dan... ekp1 - Fre... Skrzynka... CDS/ISIS... Tablica zn... Baza da... 12:59

Baza danych SAWIOS, IZTW w Krakowie - Windows Internet Explorer

http://www.ios.krakow.pl/sawios/

Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc

Ulubione Translatca naukowo-technic... Zadziwiający Tłumacz (Słow... Web of Knowledge [v.5.7] ... LEKSYKA.PL - Słowniki inter... DPC4 - results-shortlist

Baza danych Sawios, IZTW w Krakowie

Baza danych SAWIOS

Baza tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
© Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków | Instrukcja | Charakterystyka bazy | Wykaz źródeł indeksowanych w bazie | Historia zapytań
System Expertus dla baz CDS/ISIS, SPLENDOR Poznań

Wyświetl wskazówki

Autorzy: Ocoż INDEKS

Słowa z notatki: dogładz INDEKS

Język: pol INDEKS

Łączenie warunków: i / AND SZUKAJ ANULUJ

W polach słowa z tytułu oraz słowa z notatki można wpisać kilka wyrazów obok siebie.

Zawężanie wyników wyszukiwania

Rok: wszystkie lata (1988-) wybrany rok zakres lat

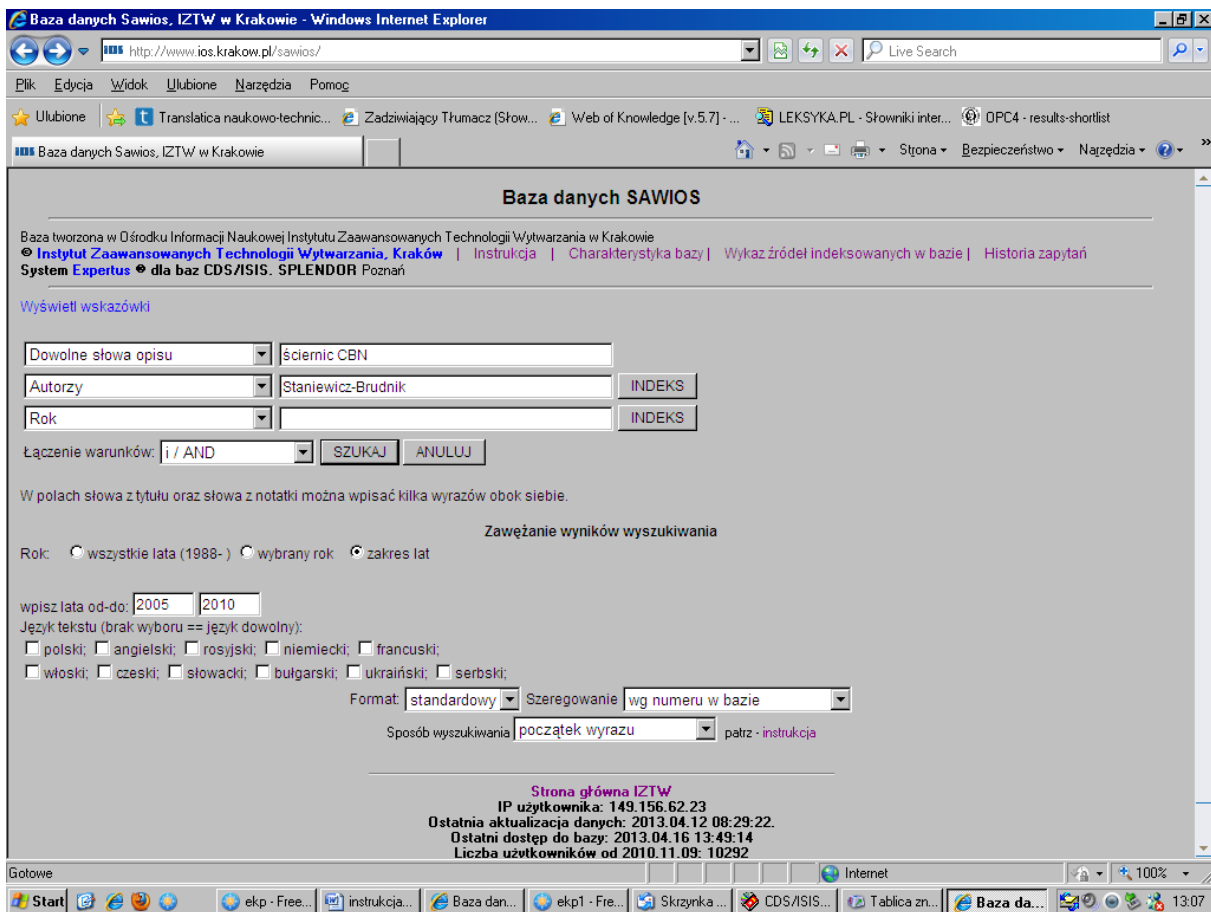
Język tekstu (brak wyboru == język dowolny):
 polski; angielski; rosyjski; niemiecki; francuski;
 włoski; czeski; słowacki; bułgarski; ukraiński; serbski;

Format: standardowy Szeregowanie wg numeru w bazie

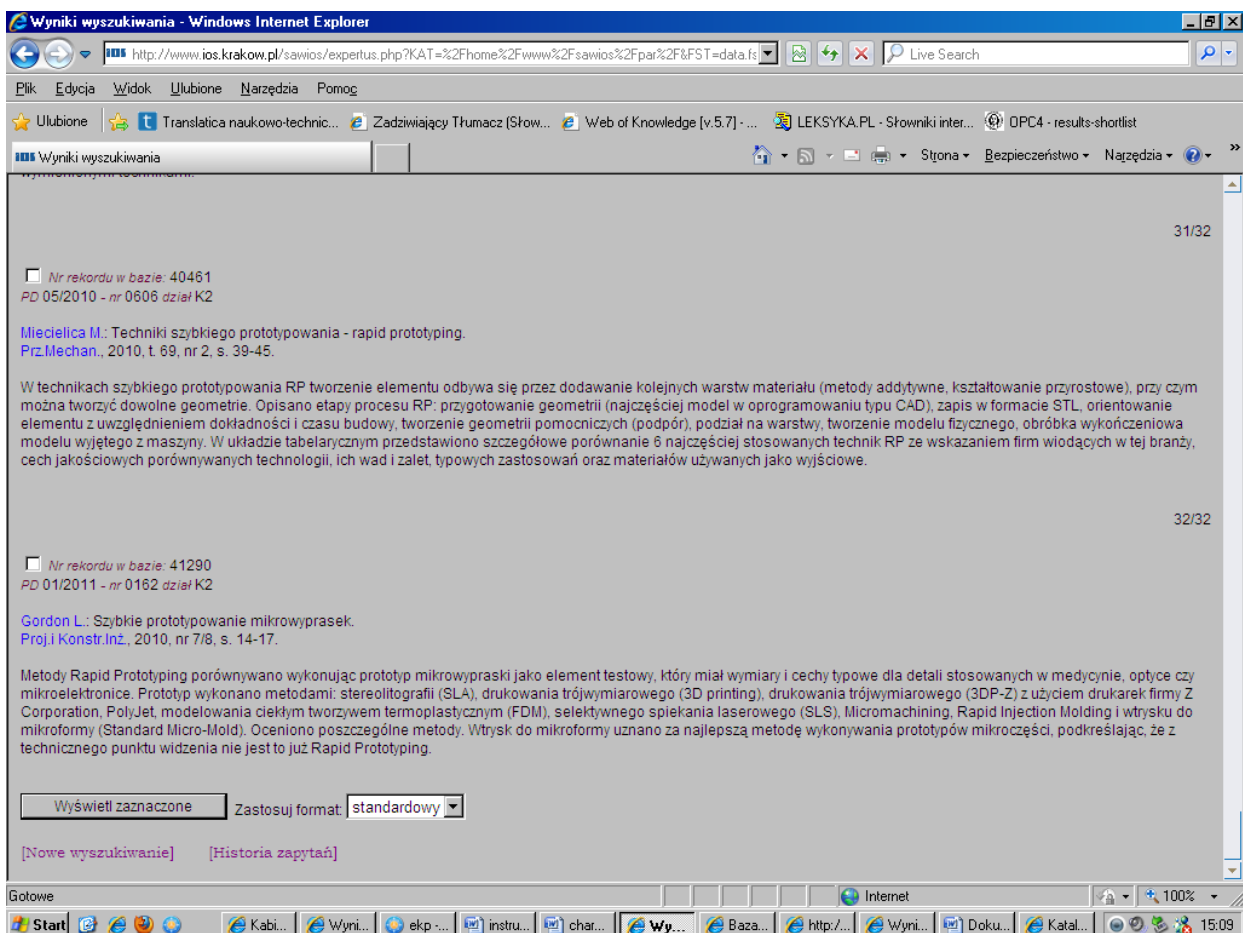
Sposób wyszukiwania: początek wyrazu patrz - instrukcja

Strona główna IZTW
IP użytkownika: 149.156.62.23
Ostatnia aktualizacja danych: 2013.04.12 08:29:22
Ostatni dostęp do bazy: 2013.04.16 13:49:14
Liczba użytkowników od 2010.11.09: 10292

Start ekp - Free... instrukcja... Baza dan... ekp1 - Fre... Skrzynka... CDS/ISIS... Tablica zn... Baza da... 13:04



A oto fragment wyniku wyszukiwania – odpowiedź wg kryteriów podanych w pierwszym przykładzie



Baza danych SAWIOS, IZTW w Krakowie - Windows Internet Explorer

http://www.ios.krakow.pl/sawios/

Baza danych SAWIOS

Baza tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 © Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków | Instrukcja | Charakterystyka bazy | Wykaz źródeł indeksowanych w bazie | Historia zapytań
 System Expertus dla baz CDS/ISIS, SPLENDOR Poznań

Wyświetl wskazówki

Autorzy: Pofelska INDEKS
 Autorzy: Czechowski INDEKS
 Rok: INDEKS

Łączenie warunków: #1 - #2 / #1 not #2 SZUKAJ ANULUJ

W polach słowa z tytułu oraz słowa z notatki można wpisać kilka wyrazów obok siebie.

Zawężanie wyników wyszukiwania
 Rok: wszystkie lata (1988-) wybrany rok zakres lat

Język tekstu (brak wyboru == język dowolny):
 polski; angielski; rosyjski; niemiecki; francuski;
 włoski; czeski; słowacki; bułgarski; ukraiński; serbski;

Format: standardowy Szeregowanie: wg numeru w bazie
 Sposób wyszukiwania: początek wyrazu patrz - instrukcja

Strona główna IZTW
 IP użytkownika: 149.156.62.23
 Ostatnia aktualizacja danych: 2013.04.12 08:29:22
 Ostatni dostęp do bazy: 2013.04.16 13:49:14
 Liczba użytkowników od 2010.11.09: 10292

Proszę zwrócić uwagę na okno powyżej tj. wybrane kryteria oraz łączenie warunków: wybraliśmy artykuły autorstwa p. Pofelskiej z wyłączeniem tych, których współautorem jest p. Czechowski. A oto fragment wyniku wyszukiwania w wersji do druku – otrzymaliśmy w odpowiedzi 7 rekordów spełniających podane kryterium.

Wyniki wyszukiwania - Windows Internet Explorer

http://www.ios.krakow.pl/sawios/expertus.php?KAT=%2Fhome%2Fwww%2Fsawios%2Fpar%2F&FST=data.fi

Wyniki wyszukiwania

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POFELSKA NOT (OR CZECHOWSKI)
 Liczba odnalezionych rekordów: 7

Zmiana formatu | Wersja do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie

1/7

Nr rekordu w bazie: 12564
 PD 14/1995 - nr 1360 dział F

Pofelska-Filip I, Biliński T.: Badania warstw TIN nanoszonych łukową metodą PVD na podłoże ze spiekanej stali szybkotnącej. Zbiór Ref.Posiedz. Sekcji Podst.Technol. KBM PAN, 1995, s. 35-43.

Przedstawiono wyniki badań warstwy TIN naniesionej łukową metodą PVD na płytki wieloostrowce typu SPUN 120308, wykonane ze spiekanej stali szybkotnącej gat. T15. Dla scharakteryzowania warstwy TIN wykonano badania i pomiary grubości, chropowatości i mikrotrwałości warstwy, jej struktury oraz składu chemicznego i fazowego. Stosowano następujące metody: profilometrię, mikroskopię optyczną i badania mikrotrwałości, kalotest - pomiar grubości warstw, fraktografię SEM, dyfrakcję rentgenowską, analizę składu chemicznego metodą spektroskopii elektronów Augera (AES). Wyniki pomiarów zilustrowano wykresami.

2/7

Nr rekordu w bazie: 13652
 PD 4/1996 - nr 0353 dział F

Pofelska-Filip I, Biliński T.: Examples of structure of TIN coatings deposited by different PVD methods on some tool materials. Przykłady struktur powłok TIN nakładanych różnymi metodami PVD na niektóre materiały narzędziowe. 14-th Int.Scient.Conf. AMT '95 (Ext.Abstr.), 1995, s. 365-372.

Struktura powłok nakładanych metodą PVD zależy w znacznym stopniu od warunków osadzania. Procesy PVD są realizowane przy różnej temperaturze powierzchni osadzonej warstwy, odchyleniu (skosie) podłoża, koncentracji jonów i szybkości osadzania warstwy. Parametry te mają wpływ na strukturę powstającej warstwy oraz jej właściwości. Scharakteryzowano podstawowe metody PVD nakładania twardych powłok i doświadczalne metody stosowane do analizy struktury twardych powłok.

Przeglądając wynik wyszukiwania możemy zaznaczyć w okienkach z lewej strony artykuły, które nas interesują, co jest bardzo istotne, jeśli wynik wyszukiwania liczy np. ponad 100 rekordów.

Na końcu dokumentu „**Wynik wyszukiwania**” klikamy w przycisk „**wyświetl zaznaczone**” i otrzymujemy wynik ograniczony do wybranych (przez zaznaczenie „okienek”) pozycji.

Klikając w przycisk „wersja do druku” i wysyłając na wybraną drukarkę uzyskujemy wydruk w postaci spisu zaznaczonych artykułów wraz z krótkimi streszczeniami.

Funkcja wyboru formatu

Wynik wyszukiwania można też wydrukować w formacie skróconym (tylko dane bibliograficzne) Proszę kliknąć w przycisk **Zmiana formatu** na wyniku wyszukiwania, a następnie wybrać z paska **Zastosuj format** na końcu wyniku wyszukiwania **format skrócony** zamiast **standardowy**.

Jeśli **Wynik wyszukiwania** zawiera „aktywne” nazwiska (na niebiesko), to oznacza, że klikając na dane nazwisko uzyskamy wynik w postaci listy publikacji danego autora zarejestrowanych w bazie.

„Aktywny” skrót tytułu czasopisma lub publikacji z konferencji odsyła nas do pozostałych artykułów z danego czasopisma lub publikacji, zarejestrowanych w bazie.